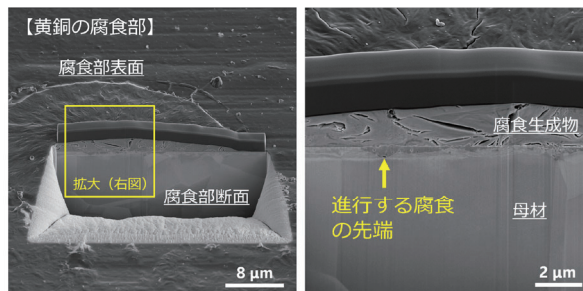


ピンポイントの断面から腐食原因を探る

FIB-SEM複合装置による腐食部の断面観察と腐食原因調査

アピールポイント

- ✓ 任意箇所の断面観察が可能
- ✓ 腐食の原因物質を特定
- ✓ 表面処理の欠陥を明らかに



技術の特徴

- SEM観察しながら断面作製箇所を決定
- 任意箇所の断面をミクロ観察や成分分析することが可能
- 内部に埋もれた腐食原因物質や表面処理の欠陥の調査に貢献

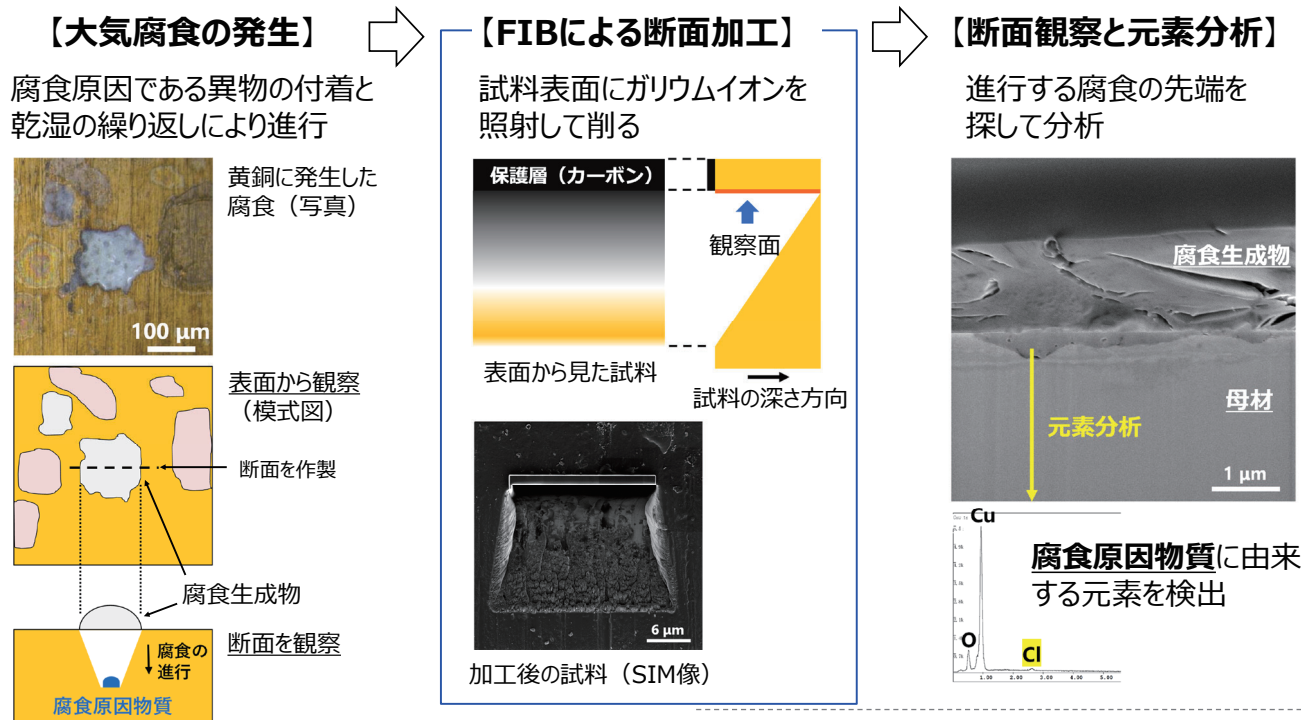
企業へのご提案

腐食によるわずかな変色もクレームにつながる可能性があります。

腐食の原因物質を特定することで、改善すべき生産プロセスが明らかになります。

金属の腐食でお悩みの方は、是非ご相談ください。

技術の概要



腐食原因物質またはその痕跡
表面からの観察では腐食生成物がふたをして確認できない

技術支援部
計測分析技術グループ
杉森 博和

FIB：集束イオンビーム SEM：走査電子顕微鏡 SIM：走査イオン顕微鏡